CF-E16 低損傷磊晶蝕刻機

(Samco 200ip Etcher) 儀器簡介

1.主要功能:

本設備為 8 吋 GaN 蝕刻機,具備干涉式 EPD 之後段製程腔體,為一低損傷電漿蝕刻系統之設計,其腔體採用 tornado ICP coil 之專利設計,進行 GaN 等材料之蝕刻,tornado ICP coil 可讓電漿控制得更穩定,進而達到慢速蝕刻率之製程。其主要製程為蝕刻 AlGaN 及 p GaN 等材料。GaN 功率元件蝕刻厚度僅奈米尺寸,於蝕刻時利用干涉式EPD 即時監測,可準確地停止於所指定的位置,且整體蝕刻均勻度及表面粗糙度均可達到極佳之水準。

2.可触刻材料:

- 1. 委託服務樣品尺寸:允許破片(至少 1cm x 1cm 以上)、4 吋、6 吋及 8 吋 晶圓。
- 2. 委託蝕刻材料:

中心將先提供 AlGaN 及 p-GaN 薄膜蝕刻:

AlGaN film thickness < 30 nm; p GaN film thickness < 100 nm

3. 委託樣品限制

限制含 Indium (In)的薄膜材料蝕刻委託,該元素已確認會嚴重影響此設備標準參數蝕刻率與均勻性,故凡樣品含此類元素的薄膜禁用此設備蝕刻,如 InAlGaN, InAlN, InGaN, InN、InAlGaAs、InAlAs、InGaAs、InAs、InGaP、InAlP、InGaP及 InP.......等。

| * | 全名: 低損傷磊晶蝕刻機 |
|----------|---|
| * | 位置: 奈米棟 / class 100 |
| * | 工程師: 許文達 (O) ext.: 7537 (C) |
| * | 代理人: 黄鉦致 (O) ext.: 7582 (C) |
| * | 機台負責人: <u>許文達 (O) ext. 7537 (C)</u> |
| * | 作業區域化學品: |
| | (1) 大宗氣體: N2、Ar |
| | (2) 特殊氣體: Cl2、BCl3 |
| | (3) 瓶裝化學品: |
| | a. 有機化合物: |
| | b. 酸/鹼劑: |
| | c. 氧化物: |
| | d. 其他: |
| * | 製程模式或反應腔: |
| | (1) EPD mode |
| | (2) |
| * | 反應腔真空度範圍: 6 x 10 ⁻⁴ pa (Process: 1~5 pa) |
| * | 抽真空泵浦: <u>Turbo pump</u> ,Dry pump |
| * | 尾氣排放物種: <u>Ar、N2、Cl2、BCl3、SF6、CHF3、O2、He</u> |
| * | 抽尾氣泵浦種類:Dry pump |
| * | 尾氣排放有無獨立之 Local Scrubber: 無 |
| * | 反應腔溫度範圍: <u>20-200 度</u> |
| * | 冷卻系統種類: <u>Circulator、廠務供應冷卻水</u> |
| * | 製造商或代理商: 莎姆克股份有限公司 |

低損傷磊晶蝕刻機 機台身份證

4.